# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004649

International filing date: 16 March 2005 (16.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-101426

Filing date: 30 March 2004 (30.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

16. 3. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 3月30日

出 願 番 号

特願2004-101426

Application Number:

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 1 0 1 4 2 6

出 願 人

株式会社山武

Applicant(s):

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 4月21日





【書類名】	特許願
整理番号	20040059
【提出日】	平成16年 3月30日
【あて先】	特許庁長官殿 G01N 21/55
【国際特許分類】 【発明者】	GOIN 21/33
【完明有】 【住所又は居所】	東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会社 山武内
【氏名】	金井 良之
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会社 山武内
【氏名】	梶尾 恭弘
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会社 山武内
【氏名】	東海林 成樹
【発明者】	東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会社 山武内
【住所又は居所】	
【氏名】	武智 昌樹
【発明者】 【住所又は居所】	東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会社 山武内
【氏名】	秋元 竜
【特許出願人】	
【識別番号】	00006666
【氏名又は名称】	株式会社 山武
【代理人】	
【識別番号】	100064621
【弁理士】	r and the
【氏名又は名称】	山川 政樹
【電話番号】	03–3580–0961
【手数料の表示】	006194
【予納台帳番号】 【納付金額】	21,000円
【提出物件の目録】	21,00011
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	0310202

## 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

その一方向面を検出面として配置されたプリズムと、

このプリズムの内部を通して前記検出面を照射する発光手段と、

前記発光手段から前記検出面に対して照射された光の正反射光を反射し前記プリズムの内部を通して前記検出面に戻すミラーと、

このミラーによって戻された光の前記検出面からの正反射光を受光する受光手段と、この受光手段が受光する正反射光に基づいて前記検出面上の状態を検出する手段とを備えたことを特徴とする検出面上状態検出装置。

## 【請求項2】

その一方向面を検出面として配置されたプリズムと、

このプリズムの内部を通して前記検出面を照射する発光手段と、

前記発光手段からの光のうち前記検出面における正反射光を受光する受光手段と、 この受光手段が受光する正反射光に基づいて前記検出面上の状態を検出する手段と を備えたことを特徴とする検出面上状態検出装置。

#### 【請求項3】

その一方向面が検出面として被測定気体に晒されるプリズムと、

前記プリズムを冷却する冷却手段と、

前記プリズムの内部を通して前記検出面を照射する発光手段と、

前記発光手段から前記検出面に対して照射された光の正反射光を反射し前記プリズムの内部を通して前記検出面に戻すミラーと、

このミラーによって戻された光の前記検出面からの正反射光を受光する受光手段と、 この受光手段が受光する正反射光に基づいて前記冷却手段によって冷却された前記プリ ズムの検出面上に生じる水分を検出する手段と

を備えたことを特徴とする水分検出装置。

## 【請求項4】

その一方向面が検出面として被測定気体に晒されるプリズムと、

前記プリズムを冷却する冷却手段と、

前記プリズムの内部を通して前記検出面を照射する発光手段と、

前記発光手段からの光のうち前記検出面における正反射光を受光する受光手段と、

この受光手段が受光する正反射光に基づいて前記冷却手段によって冷却された前記プリズムの検出面上に生じる水分を検出する手段と

を備えたことを特徴とする水分検出装置。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】検出面上状態検出装置および水分検出装置

## 【技術分野】

## [0001]

この発明は、検出面上の状態を検出する検出面上状態検出装置および検出面上に生じる 被測定気体に含まれる水分を検出する水分検出装置に関するものである。

## 【背景技術】

## [0002]

従来より、湿度測定法として、被測定気体の温度を低下させ、その被測定気体に含まれる水蒸気の一部を結露させたときの温度を測定することにより露点を検出する露点検出法が知られている。例えば、非特許文献1には、寒剤、冷凍機、電子冷却器などを用いて鏡を冷却し、この冷却した鏡の鏡面上の反射光の強度の変化を検出し、この時の鏡面の温度を測定することによって、被測定気体中の水分の露点を検出する鏡面冷却式露点計について説明されている。

#### [0003]

この鏡面冷却式露点計には、利用する反射光の種類によって、2つのタイプがある。1 つは、正反射光を利用する正反射光検出方式(例えば、特許文献1参照)、もう1つは、 散乱光を利用する散乱光検出方式(例えば、特許文献2参照)である。

#### [0004]

## 〔正反射光検出方式〕

図12に正反射光検出方式を採用した従来の鏡面冷却式露点計の要部を示す。この鏡面冷却式露点計101は、被測定気体が流入されるチャンバ1と、このチャンバ1の内部に設けられた熱電冷却素子 (ペルチェ素子) 2を備えている。熱電冷却素子 2の冷却面 2 - 1には銅製ブロック 3 を介してボルト 4 が取り付けられており、熱電冷却素子 2 の加熱面 2 - 2には放熱フィン 5 が取り付けられている。銅製ブロック 3 に取り付けられたボルト 4 の上面 4 - 1 は鏡面とされている。銅製ブロック 3 の側部には巻線式測温抵抗体(温度検出素子) 6 が埋め込まれている(図16 参照)。また、チャンバ1の上部には、ボルト 4 の上面(鏡面) 4 - 1 に対して斜めに光を照射する発光素子 7 と、この発光素子 7 から鏡面 4 - 1 に対して照射された光の正反射光を受光する受光素子 8 とが設けられている。

#### [0005]

この鏡面冷却式露点計101において、チャンバ1内の鏡面4-1は、チャンバ1内に流入される被測定気体に晒される。鏡面4-1に結露が生じていなければ、発光素子7から照射された光はそのほぐ全量が正反射し、受光素子8で受光される。したがって、鏡面4-1に結露が生じていない場合、受光素子8で受光される反射光の強度は大きい。

#### [0006]

熱電冷却素子 2 への電流を増大し、熱電冷却素子 2 の冷却面 2-1 の温度を下げて行くと、被測定気体に含まれる水蒸気が鏡面 4-1 に結露し、その水の分子に発光素子 7 から照射した光の一部が吸収されたり、乱反射したりする。これにより、受光素子 8 で受光される反射光(正反射光)の強度が減少する。この鏡面 4-1 における正反射光の変化を検出することにより、鏡面 4-1 上の状態の変化、すなわち鏡面 4-1 上に水分(水滴)が付着したことを知ることができる。さらに、この時の鏡面 4-1 の温度を温度検出素子 6 で間接的に測定することにより、被測定気体中の水分の露点を知ることができる。

#### [0007]

#### [散乱光検出方式]

図13に散乱光検出方式を採用した従来の鏡面冷却式露点計の要部を示す。この鏡面冷却式露点計102は、正反射光検出方式を採用した鏡面冷却式露点計101とほど同構成であるが、受光素子8の取り付け位置が異なっている。この鏡面冷却式露点計102において、受光素子8は、発光素子7から鏡面4-1に対して照射された光の正反射光を受光する位置ではなく、散乱光を受光する位置に設けられている。

#### [0008]

この鏡面冷却式露点計102において、鏡面4-1は、チャンバ1内に流入される被測定気体に晒される。鏡面4-1に結露が生じていなければ、発光素子7から照射された光はそのほぐ全量が正反射し、受光素子8での受光量は極微量である。したがって、鏡面4-1に結露が生じていない場合、受光素子8で受光される反射光の強度は小さい。

#### [0009]

熱電冷却素子 2への電流を増大し、熱電冷却素子 2 の冷却面 2-1 の温度を下げて行くと、被測定気体に含まれる水蒸気が鏡面 4-1 に結露し、その水の分子に発光素子 7 から照射した光の一部が吸収されたり、乱反射したりする。これにより、受光素子 8 で受光される乱反射された光(散乱光)の強度が増大する。この鏡面 4-1 における散乱光の変化を検出することにより、鏡面 4-1 上の状態の変化、すなわち鏡面 4-1 上に水分(水滴)が付着したことを知ることができる。さらに、この時の鏡面 4-1 の温度を温度検出素子 6 で間接的に測定することにより、被測定気体中の水分の露点を知ることができる。

## [0010]

なお、上述した露点計においては、鏡面 4-1 に生じる結露(水分)を検出する例で説明したが、同様の構成によって鏡面 4-1 に生じる結霜(水分)を検出することも可能である。

#### $[0\ 0\ 1\ 1]$

また、図14や図15に示すように構成すれば、すなわち熱電冷却素子2や温度検出素子6などをなくし、チャンバ1内に鏡9のみを設け、チャンバ1上面に開口部を設けた構成とすれば、雨や雪などの降り始めに鏡面9-1に付着する水分を検出する鏡面上状態検出装置(天気計)として使用することも可能である。この天気計103や104では、雨や雪などがチャンバ1内に引き込まれ、鏡9の鏡面9-1に付着すると、その付着が受光素子8で受光される反射光の強度に基づいて検出される。

#### [0012]

【特許文献1】特開昭61-75235号公報

【特許文献2】特公平7-104304号公報

【非特許文献1】工業計測ハンドブック、昭和51.9.30、朝倉書店、P297。

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### $[0\ 0\ 1\ 3]$

しかしながら、上述した従来の鏡面冷却式露点計101や102、天気計103や104では、結露や結霜を検出するための発光素子7や受光素子8などの光学系を鏡面(検出面)4-1の上方に設けているので、鏡面4-1の清掃時に邪魔になり、清掃し難かった。また、鏡面4-1にゴミなどが付着すると反射光の強度が弱まり、測定誤差が大きくなってしまうという問題があった。

#### [0014]

本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、検出面の清掃がし易く、ゴミの影響を受けづらい検出面上状態検出装置および水分検出装置を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

#### [0015]

このような目的を達成するために、第1発明(請求項1に係る発明)は、検出面上状態 検出装置に係わり、その一方向面を検出面として配置されたプリズムと、このプリズムの 内部を通して検出面を照射する発光手段と、発光手段から検出面に対して照射された光の 正反射光を反射しプリズムの内部を通して検出面に戻すミラーと、このミラーによって戻 された光の検出面からの正反射光を受光する受光手段と、この受光手段が受光する正反射 光に基づいて検出面上の状態を検出する手段とを設けたものである。

この発明によれば、プリズムの一方向面、例えば三角プリズムの長辺の面(長辺面)が 検出面とされ、この検出面にプリズムの内部を通して光が照射され、この検出面に照射さ れた光すなわち検出面の裏面に照射された光の正反射光がミラーによってプリズムの内部 を通して検出面の裏面に戻され、このミラーによって戻された光の検出面の裏面からの正 反射光が受光され、この受光される正反射光に基づいて検出面上の状態(例えば、雨や雪 の付着)が検出される。

## [0016]

この第1発明において、プリズムの検出面に雨や雪などが付着すると、発光手段から検出面の裏面に照射された光の一部がその付着した雨や雪などを通してプリズムの外へ抜ける。このため、検出面の裏面に照射された光の正反射光が減少する。この正反射光はミラーによって検出面の裏面に戻され、ここで再び正反射し、受光手段によって受光される。この受光される光の強度変化によって検出面への雨や雪の付着を検出することができる。特に、この発明では、ミラーで光を全反射することにより、光が検出面の裏面を2回通過することになり、光の減衰度合いが増す。

#### [0017]

第2発明(請求項2に係る発明)は、その一方向面を検出面として配置されたプリズムと、このプリズムの内部を通して検出面を照射する発光手段と、発光手段からの光のうち検出面における正反射光を受光する受光手段と、この受光手段が受光する正反射光に基づいて検出面上の状態を検出する手段とを設けたものである。

この発明によれば、プリズムの一方向面、例えば三角プリズムの長辺面が検出面とされ、この検出面にプリズムの内部を通して光が照射され、この検出面に照射された光すなわち検出面の裏面に照射された光の正反射光が受光され、この受光される正反射光に基づいて検出面上の状態(例えば、雨や雪の付着)が検出される。

#### [0018]

この第2発明において、プリズムの検出面に雨や雪などが付着すると、発光手段から検出面の裏面に照射された光の一部がその付着した雨や雪などを通してプリズムの外へ抜ける。このため、検出面の裏面に照射された光の正反射光が減少する。この正反射光は受光手段によって受光される。この受光される光の強度変化によって検出面への雨や雪の付着を検出することができる。

#### [0019]

第3発明(請求項3に係る発明)は、その一方向面が検出面として被測定気体に晒されるプリズムと、プリズムを冷却する冷却手段と、プリズムの内部を通して検出面を照射する発光手段と、発光手段から検出面に対して照射された光の正反射光を反射しプリズムの内部を通して検出面に戻すミラーと、このミラーによって戻された光の検出面からの正反射光を受光する受光手段と、この受光手段が受光する正反射光に基づいて冷却手段によって冷却されたプリズムの検出面上に生じる水分を検出する手段とを設けたものである。

この発明によれば、被測定気体に晒されるプリズムの一方向面、例えば三角プリズムの 長辺面が検出面とされ、この検出面にプリズムの内部を通して光が照射され、この検出面 に照射された光すなわち検出面の裏面に照射された光の正反射光がミラーによって検出面 の裏面に戻され、このミラーによって戻された光の検出面の裏面からの正反射光が受光さ れ、この受光される正反射光に基づいて、冷却手段によって冷却されたプリズムの検出面 上に生じる水分(例えば、結露や結霜)が検出される。

## [0020]

この第3発明において、プリズムの検出面に結露や結霜が生じると、発光手段から検出面の裏面に照射された光の一部がその結露や結霜を通してプリズムの外へ抜ける。このため、検出面の裏面に照射された光の正反射光が減少する。この正反射光はミラーによって検出面の裏面に戻され、ここで再び正反射し、受光手段によって受光される。この受光される光の強度変化によって検出面に生じる結露や結霜を検出することができる。特に、この発明では、ミラーで光を全反射することにより、光が検出面の裏面を2回通過することになり、光の減衰度合いが増す。

#### [0021]

第4発明(請求項4に係る発明)は、水分検出装置に係わり、その一方向面が検出面として被測定気体に晒されるプリズムと、プリズムを冷却する冷却手段と、プリズムの内部

を通して検出面を照射する発光手段と、発光手段からの光のうち検出面における正反射光を受光する受光手段と、この受光手段が受光する正反射光に基づいて冷却手段によって冷却されたプリズムの検出面上に生じる水分を検出する手段とを設けたものである。

この発明によれば、被測定気体に晒されるプリズムの一方向面、例えば三角プリズムの長辺面が検出面とされ、この検出面にプリズムの内部を通して光が照射され、この検出面に照射された光すなわち検出面の裏面に照射された光の正反射光が受光され、この受光される正反射光に基づいて、冷却手段によって冷却されたプリズムの検出面上に生じる水分(例えば、結露や結霜)が検出される。

## [0022]

この第4発明において、プリズムの検出面に結露や結霜が生じると、発光手段から検出面の裏面に照射された光の一部がその結露や結霜を通してプリズムの外へ抜ける。このため、検出面の裏面に照射された光の正反射光が減少する。この正反射光は受光手段によって受光される。この受光される光の強度変化によって検出面に生じる結露や結霜を検出することができる。

#### 【発明の効果】

## [0023]

本発明によれば、プリズムの内部を通して検出面(検出面の裏面)に光を照射し、この検出面の裏面に対して照射した光の正反射光に基づいて検出面上の状態を検出したり、検出面上に生じる水分を検出するようにしたので、検出面の上面に光学系を配置しなくてもよくなり、検出面の清掃がし易くなる。また、検出面にゴミなどが付着しても、このゴミからプリズムの外へ抜ける光はないに等しく、ゴミの影響を受けづらくすることができるようになる。

## 【発明を実施するための最良の形態】

## [0024]

以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。

〔実施の形態1:鏡面冷却式露点計(反射方式)〕

図1はこの発明に係る水分検出装置の一実施の形態を示す鏡面冷却式露点計の概略構成図である。この鏡面冷却式露点計201はセンサ部201Aとコントロール部201Bとを有している。

#### [0025]

センサ部 201 Aでは、三角プリズム(以下、単にプリズムと言う) 19 を設け、このプリズム 19 の長辺の面(長辺面) 19-1 を検出面としている。また、プリズム 19 の長辺面(検出面) 19-1 に接する一方の短辺の面(短辺面) 19-2 に熱電冷却素子(ペルチェ素子) 2 を取り付けている。プリズム 19 の短辺面 19-2 には鏡 10 を取り付けている。鏡 10 は、例えばミラーコーティングとされている。また、鏡 10 と熱電冷却素子 2 の冷却面 2-1 との接合面に、例えば白金による薄膜測温抵抗体(温度検出素子) 11 を形成している。また、熱電冷却素子 2 の加熱面 2-2 に円柱状のヒートシンク 18 を接合している。

#### [0026]

また、プリズム 19の検出面 19-1に接する他方の短辺面 19-3にステンレス製のチューブ(又はケーブル) 17の先端面を接合している。チューブ 17としては図 2に示すような光ファイバを収容した種々のチューブ 16を使用することができる。図 2(a)では、チューブ 16中に、発光側の光ファイバ 16-1と受光側の光ファイバ 16-2とを同軸に設けている。図 2(b)では、チューブ 16中に、発光側(あるいは受光側)の光ファイバ 16-21~16-24を同軸に設けている。図 2(c)では、チューブ 16中の左半分を発光側の光ファイバ 16 中の 16中に、発光側の光ファイバ 16 bとしている。図 2(d)では、チューブ 16中に、発光側の光ファイバ 16 cと受光側の光ファイバ 16 dとを混在させている。図 2(e)では、チューブ 16中の中心部を発光側(あるいは受光側)の光ファイバ 16 e、光ファイバ 16 eの周囲を受光側(あるいは発光側)の光ファイバ 16 f としている。

## [0027]

図1に示した鏡面冷却式露点計 201では、チューブ 17として図 2 (a) に示された タイプのチューブ 16 を使用しており、その内部に発光側の光ファイバ 17-1 と受光側の光ファイバ 17-2 とを有している。発光側の光ファイバ 17-1 と受光側の光ファイバ 17-2 の先端部(発光部、受光部)は、プリズム 19 の短辺面 19-3 に接合され、プリズム 19 の検出面 19-1 の裏面(検出面裏面) 19-4 に向けられている。この結果、光ファイバ 17-1 からの光の照射方向(光軸)と光ファイバ 17-2 での光の受光方向(光軸)とが平行とされ、また隣接して同一の傾斜角とされる。

#### [0028]

この実施の形態において、プリズム 19の短辺面 19-2 と 19-3 とのなす角度は 9 0°、長辺面 19-1 と短辺面 19-2 とのなす角度および長辺面 19-1 と短辺面 19-3 とのなす角度は 45° とされており、従って光ファイバ 17-1 および 17-2 の光軸の検出面裏面 19-4 に対する傾斜角は 45° とされている。

#### [0029]

コントロール部201Bには、露点温度表示部12と、結露検知部13と、ペルチェ出力制御部14と、信号変換部15とが設けられている。露点温度表示部12には温度検出素子11が検出するプリズム19の温度が表示される。結露検知部13は、光ファイバ17-1の先端部よりプリズム19の検出面裏面19-4に対して所定の周期でパルス光を照射させるとともに、後述するようにして光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の上限値と下限値との差を反射パルス光の強度として求め、反射パルス光の強度に応じた信号S1をペルチェ出力制御部14へ送る。ペルチェ出力制御部14は、結露検知部13からの信号S1を受けて、反射パルス光の強度と予め定められている閾値とを比較し、反射パルス光の強度が閾値を上回っている場合には、熱電冷却素子2への電流を信号S1の値に応じて増大させる制御信号S2を、反射パルス光の強度が閾値を下回っている場合には、熱電冷却素子2への電流を信号S1の値に応じて減少させる制御信号S2を信号変換部15へ出力する。信号変換部15は、ペルチェ出力制御部14からの制御信号S2で指示される電流S3を熱電冷却素子2へ供給する。

#### [0030]

この鏡面冷却式露点計 201 において、センサ部 201 A は被測定気体中に置かれる。また、結露検知部 13 は、光ファイバ 17-1 の先端部より、プリズム 19 の検出面裏面 19-4 に対して所定の周期でパルス光を照射させる(図 3 (a) 参照)。検出面 19-1 は被測定気体に晒されており、検出面 19-1 に結露が生じていなければ、光ファイバ 17-1 の先端部から照射されたパルス光はその全量が検出面裏面 19-4 で正反射(全反射)し、プリズム 19 の短辺面 19-2 に位置する鏡面 10-1 に達する。そして、この鏡面 10-1 で全反射し、検出面裏面 19-4 に戻され、この検出面裏面 19-4 で全反射してから、ほ 100 の光量で光ファイバ 17-2 に入る。したがって、検出面 19-1 に結露が生じていない場合、光ファイバ 17-2 を介して受光される反射パルス光の強度は大きい。

#### [0031]

結露検知部13では、光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の上限値と下限値との差を反射パルス光の強度として求め、反射パルス光の強度に応じた信号S1をペルチェ出力制御部14へ送る。この場合、反射パルス光の強度は大きく、閾値を超えているので、ペルチェ出力制御部14は、熱電冷却素子2への電流を増大させる制御信号S2を信号変換部15へ送る。これにより、信号変換部15からの熱電冷却素子2への電流S3が増大し、熱電冷却素子2の冷却面2-1の温度が下げられて行く。

#### [0032]

熱電冷却素子 2 の冷却面 2-1 の温度、すなわちプリズム 1 9 の温度を下げて行くと、被測定気体に含まれる水蒸気がプリズム 1 9 の検出面 1 9 -1 に結露し、光ファイバ 1 7 -1 から検出面裏面 1 9 -4 に照射された光の一部がその結露を通してプリズム 1 9 の外へ抜ける(図 4 参照)。このため、検出面裏面 1 9 -4 での全反射がなくなり、検出面裏

面19-4に照射された光の正反射光が減少する。この正反射光は鏡面10-1によって 検出面裏面19-4に戻され、ここで再び正反射し、光ファイバ17-2に入る。特に、 この実施の形態では、鏡面10-1で光を全反射することにより、光が検出面裏面19-4を2回通過することになり、光の減衰度合いが増す。これにより、光ファイバ17-2 を介して受光される反射パルス光の強度が減少する。

## [0033]

結露検知部13は、受光される反射パルス光の1パルス毎に、その1パルスの上限値と 下限値との差を求め、これを反射パルス光の強度とする。すなわち、図3(b)に示すよ うに、反射パルス光の1パルスの上限値Lmaxと下限値Lminとの差ΔLを求め、こ の Δ L を反射パルス光の強度とする。この結露検知部 1 3 での処理により、反射パルス光 に含まれる外乱光 Δ X が除去され、外乱光による誤動作が防止される。この結露検知部 1 3でのパルス光を用いた外乱光による誤動作防止の処理方式をパルス変調方式と呼ぶ。こ の処理によって、この鏡面冷却式露点計201では、センサ部201Aからチャンバをな くすことができている。

## [0034]

ここで、光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の強度が閾値を下回ると 、ペルチェ出力制御部14は、熱電冷却素子2への電流を減少させる制御信号S2を信号 変換部15へ送る。これにより、熱電冷却素子2の冷却面2-1の温度の低下が抑えられ 、結露の発生が抑制される。この結露の抑制により、光ファイバ17-2を介して受光さ れる反射パルス光の強度が小さくなり、閾値を上回ると、ペルチェ出力制御部14から熱 電冷却素子2への電流を増大させる制御信号S2が信号変換部15へ送られる。この動作 の繰り返しによって、光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の強度が閾値 とほゞ等しくなるように、熱電冷却素子2の冷却面2-1の温度が調整される。この調整 された温度、すなわち検出面19-1に生じた結露が平衡状態に達した温度(露点温度) が、露点温度として露点温度表示部12に表示される。

## [0035]

この鏡面冷却式露点計201では、プリズム19の内部を通して検出面裏面19-4に 光を照射し、この検出面裏面19-4に対して照射した光の正反射光に基づいて検出面1 9-1上に生じる結露を検出するようにしているので、検出面19-1の上面に光学系を 配置しなくてもよくなり、検出面19-1の清掃がし易くなる。また、検出面19-1に ゴミなどが付着しても、このゴミからプリズム19の外へ抜ける光はないに等しく、検出 面裏面19-4での全反射が続けられ、ゴミの影響を受けづらくすることができる。

#### [0036]

また、この鏡面冷却式露点計201では、発光側の光ファイバ17-1と受光側の光フ ァイバ17-2の取り付け部が1箇所にまとめられており、検出部201Aの小型化に貢 献している。また、発光側の光ファイバ17-1と受光側の光ファイバ17-2とがチュ ーブ17に収容されているので、発光側の光ファイバ17-1と受光側の光ファイバ17 - 2 との間での位置決めは必要なく、組立時の作業性がよくなる。

#### [0037]

また、この鏡面冷却式露点計201では、センサ部201Aからチャンバをなくし、チ ャンバ内に被測定気体を引き込むための吸引ポンプや吸引用チューブ、排気用チューブ、 流量計など省略することができているので、部品点数が削減され、センサ部201Aのさ らなる小型化が図られ、組立性が向上し、コストもダウンする。また、吸引ポンプや吸引 用チューブ、排気用チューブ、流量計などを装着しなくてもよいので、測定雰囲気中への 設置も容易となる。また、センサ部201Aには吸引ポンプや吸引用チューブ、排気用チ ユーブ、流量計などの装着が伴わず、センサ部201Aとコントロール部201Bとの2 つの構成となるので、持ち運びが容易となる。

#### [0038]

図7にコントロール部201Bをコントロールボックス21に収容した鏡面冷却式露点 計201の構成を示す。コントロールボックス21において、収容されたコントロール部

201Bへの電源は電池とされており、コントロールボックス21とセンサ部201Aを 1組にして現場に赴き、センサ部201Aを測定雰囲気中に設置することにより、すぐに 測定を始めることができる。この例では、コントロールボックス21とセンサ部201A とを別体としているが、センサ部201Aをコントロールボックス21に設け、一体化す るようにしてもよい。

## [0039]

また、この鏡面冷却式露点計201では、熱電冷却素子2の冷却面2-1と鏡10との 接合面に温度検出素子11を設けているので、熱抵抗が少なく、精度よくかつ応答性よく プリズム19の温度を測定することができる。これにより、露点温度の測定精度が高まり 、応答性も向上する。また、鏡10をプリズム19の短辺面19-2で一体化して小型に することができ、組立性の向上が実現でき、部品点数の削減、コストの低減も可能になる 。また、鏡10は熱電冷却素子2の冷却面2-1に接合してもよく、これにより熱電冷却 素子2と鏡10とを一体形状として小型にすることができる。

## [0040]

なお、図1に示した鏡面冷却式露点計201では、センサ部201Aにおいて発光側の 光ファイバ17-1と受光側の光ファイバ17-2とを収容したチューブ17を用いたが 、発光側の光ファイバ17-1に代えて発光ダイオードを、受光側の光ファイバ17-2 に代えてフォトカプラを設けるようにしてもよい。また、投受光の光ファイバをレンズ等 で集光し、平行光にするようにしてもよい。

#### [0041]

〔実施の形態 2 :鏡面冷却式露点計 (透過方式) 〕

図 5 はこの発明に係る水分検出装置の他の実施の形態を示す鏡面冷却式露点計の概略構 成図である。この鏡面冷却式露点計202では、発光側の光ファイバ17-1と受光側の 光ファイバ17-2とを同軸ではなく、プリズム19の短辺面19-2側と19-3側と に個別に設けている。すなわち、プリズム19の短辺面19-3に発光側の光ファイバ1 7-1の先端面(発光部)を接合し、プリズム19の短辺面19-2に受光側の光ファイ バ17-2の先端面(受光部)を接合している。また、熱電冷却素子2の中央部に中空部 2-3を、ヒートシンク18の中央部に中空部18-1を設け、この中空部2-3および 18-1を通して光ファイバ17-2を設けている。なお、この実施の形態では、図1に 示したような鏡10は用いておらず、プリズム19の短辺面19-2と熱電冷却素子2の 冷却面2-1との接合面に温度検出素子11を位置させている。

#### [0042]

この鏡面冷却式露点計202において、センサ部202Aは被測定気体中に置かれる。 また、結露検知部13は、光ファイバ17-1の先端部より、プリズム19の検出面裏面 19-4に対して所定の周期でパルス光を照射させる。検出面19-1は被測定気体に晒 されており、検出面19-1に結露が生じていなければ、光ファイバ17-1の先端部か ら照射されたパルス光はその全量が検出面裏面19-4で正反射(全反射)し、プリズム 19の短辺面19-2に位置する光ファイバ17-2にほゞ100%の光量で入る。した がって、検出面19-1に結露が生じていない場合、光ファイバ17-2を介して受光さ れる反射パルス光の強度は大きい。

#### [0043]

結露検知部13では、光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の上限値と 下限値との差を反射パルス光の強度として求め、反射パルス光の強度に応じた信号S1を ペルチェ出力制御部14へ送る。この場合、反射パルス光の強度は大きく、閾値を超えて いるので、ペルチェ出力制御部14は、熱電冷却素子2への電流を増大させる制御信号S 2を信号変換部15へ送る。これにより、信号変換部15からの熱電冷却素子2への電流 S3が増大し、熱電冷却素子2の冷却面2-1の温度が下げられて行く。

#### [0044]

熱電冷却素子2の冷却面2-1の温度、すなわちプリズム19の温度を下げて行くと、 被測定気体に含まれる水蒸気がプリズム19の検出面19-1に結露し、光ファイバ17

-1から検出面裏面19-4に照射された光の一部がその結露を通してプリズム19の外 へ抜ける(図6参照)。このため、検出面裏面19-4での全反射がなくなり、検出面裏 面19-4に照射された光の正反射光が減少する。この正反射光は光ファイバ17-2に 入る。これにより、光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の強度が減少す る。

## $[0\ 0\ 4\ 5]$

ここで、光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の強度が閾値を下回ると 、ペルチェ出力制御部14は、熱電冷却素子2への電流を減少させる制御信号S2を信号 変換部15へ送る。これにより、熱電冷却素子2の冷却面2-1の温度の低下が抑えられ 、結露の発生が抑制される。この結露の抑制によって、光ファイバ17-2を介して受光 される反射パルス光の強度が大きくなり、閾値を上回ると、ペルチェ出力制御部14から 熱電冷却素子2への電流を増大させる制御信号S2が信号変換部15へ送られる。この動 作の繰り返しによって、光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の強度が閾 値とほゞ等しくなるように、熱電冷却素子2の冷却面2-1の温度が調整される。この調 整された温度、すなわち検出面19-1に生じた結露が平衡状態に達した温度 (露点温度 )が、露点温度として露点温度表示部12に表示される。

#### [0046]

この鏡面冷却式露点計202においても、プリズム19の内部を通して検出面裏面19 - 4に光を照射し、この検出面裏面19-4に対して照射した光の正反射光に基づいて検 出面19-1上に生じる結露を検出するようにしているので、検出面19-1の上面に光 学系を配置しなくてもよくなり、検出面19-1の清掃がし易くなる。また、検出面19 -1にゴミなどが付着しても、このゴミからプリズム19の外へ抜ける光はないに等しく 、検出面裏面19-4での全反射が続けられ、ゴミの影響を受けづらくすることができる

## [0047]

なお、上述した実施の形態1や2では、熱電冷却素子2の冷却面2-1と鏡10との接 合面に温度検出素子11を設けてプリズム19の温度を検出するのみとしたが、図8や図 9に示すように、熱電冷却素子2の加熱面2-2とヒートシンク18との接合面に温度検 出素子22を設ければ、ヒートシンク18の温度を精度よくかつ応答性よく測定し、ヒー トシンク18の温度がある温度に達したら熱電冷却素子2への電流を遮断したり制限する などして、プリズム19の冷却効率を上げるようにすることも可能である。

#### [0048]

また、上述した実施の形態1や2では、検出面19-1に生じる結露(水分)を検出す るものとしたが、同様の構成によって検出面19-1に生じる結霜(水分)を検出するこ とも可能である。

また、上述した実施の形態1や2では、プリズム19を冷却する冷却手段として熱電冷 却素子(ペルチェ素子)2を用いたが、ヘリウム冷凍機などを用いてもよい。

また、上述した実施の形態1や2では、熱電冷却素子2をプリズム19の短辺面19-2に設けるようにしたが、必ずしも短辺面19-2に設けなくてよく、検出面19-1以 外であればどの位置に熱電冷却素子2を設けてもよい。

#### [0049]

〔実施の形態3:天気計(反射方式)〕

図10はこの発明に係る鏡面上状態検出装置の一実施の形態を示す天気計の概略構成図 である。この天気計203はセンサ部203Aと雨検知部203Bとを有している。セン サ部203Aは、プリズム19のみを設けた構成とし、実施の形態1と同様にして、チュ ーブ17の先端部をプリズム19の短辺面19-3に接合している。なお、この実施の形 態では、プリズム19の短辺面19-2にミラーコート20を施している。

#### [0050]

この天気計203において、雨検知部203Bは、光ファイバ17-1の先端部よりプ リズム19の検出面裏面19-4に対して所定の周期でパルス光を照射させるとともに、

光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の上限値と下限値との差を反射パル ス光の強度として求め、この反射パルス光の強度と予め定められている閾値とを比較し、 反射パルス光の強度が閾値を下回ると雨が降り始めた(検出面19-1に雨が付着した) と判断する。

#### [0051]

[実施の形態4:天気計(透過光方式)]

図11はこの発明に係る鏡面上状態検出装置の他の実施の形態を示す天気計の概略構成 図である。この天気計204はセンサ部204Aと雨検知部204Bとを有している。セ ンサ部204Aは、プリズム19のみを設けた構成とし、実施の形態2と同様にして、光 ファイバ17-1の先端部をプリズム19の短辺面19-3に接合し、受光側の光ファイ バ17-2をプリズム19の短辺面19-2に接合している。

#### [0052]

この天気計204において、雨検知部204Bは、光ファイバ17-1の先端部よりプ リズム19の検出面裏面19-4に対して所定の周期でパルス光を照射させるとともに、 光ファイバ17-2を介して受光される反射パルス光の上限値と下限値との差を反射パル ス光の強度として求め、この反射パルス光の強度と予め定められている閾値とを比較し、 反射パルス光の強度が閾値を下回ると雨が降り始めた(検出面19-1に雨が付着した) と判断する。

#### [0053]

なお、上述した実施の形態3や4では、検出面19-1上に付着する雨を検出するよう にしたが、同様の構成によって検出面19-1上に付着する雪を検出することも可能であ

また、上述した実施の形態1~4では、プリズム19として三角プリズムを用いたが、 三角プリズムの底面をカットした台形状のプリズムを用いるなどしてもよく、他にも色々 な形状のプリズムの利用が考えられる。

## 【図面の簡単な説明】

#### [0054]

- 【図1】本発明に係る水分検出装置の一実施の形態を示す鏡面冷却式露点計の概略構 成図(実施の形態1)である。
- 【図2】発光側の光ファイバと受光側の光ファイバとを1つのチューブ中に同軸に設 ける構成を例示する図である。
- 【図3】検出面裏面に対して照射されるパルス光および検出面裏面から受光される反 射パルス光を示す図である。
- 【図4】実施の形態1において検出面裏面に照射された光の一部が検出面に生じた結 露を通してプリズムの外へ抜ける様子を示す図である。
- 【図5】本発明に係る水分検出装置の他の実施の形態を示す鏡面冷却式露点計の概略 構成図(実施の形態2)である。
- 【図6】実施の形態2において検出面裏面に照射された光の一部が検出面に生じた結 露を通してプリズムの外へ抜ける様子を示す図である。
- 【図7】コントロール部をコントロールボックスに収容した鏡面冷却式露点計の構成 を示す図である。
- 【図8】熱電冷却素子の加熱面とヒートシンクとの接合面にも温度検出素子を設けた 実施の形態1の鏡面冷却式露点計のセンサ部の変形例を示す図である。
- 【図9】熱電冷却素子の加熱面とヒートシンクとの接合面にも温度検出素子を設けた 実施の形態2の鏡面冷却式露点計のセンサ部の変形例を示す図である。
- 【図10】本発明に係る鏡面上状態検出装置の一実施の形態を示す天気計の概略構成 図(実施の形態3)である。
- 【図11】本発明に係る鏡面上状態検出装置の他の実施の形態を示す天気計の概略構 成図(実施の形態4)である。
- 【図12】正反射光検出方式を採用した従来の鏡面冷却式露点計の要部を示す図であ

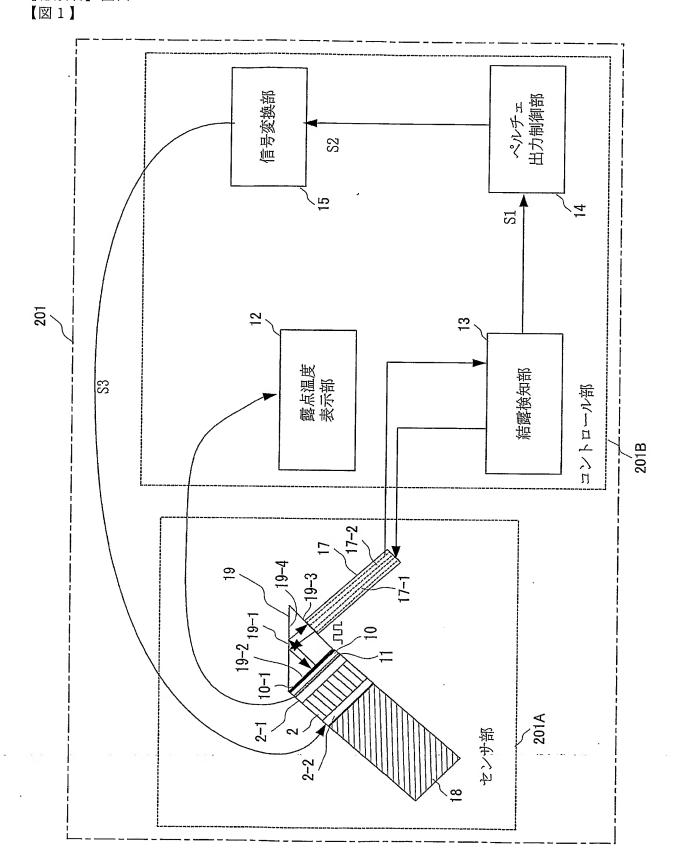
る。

- 【図13】散乱光検出方式を採用した従来の鏡面冷却式露点計の要部を示す図である
- 【図14】正反射光検出方式を採用した従来の天気計の要部を示す図である。
- 【図15】散乱光検出方式を採用した従来の天気計の要部を示す図である。
- 【図16】従来の鏡面冷却式露点計における鏡や温度検出素子の取り付け構造を示す斜視図である。

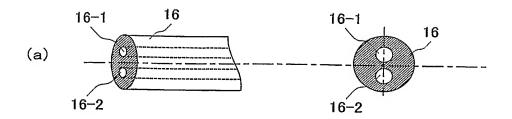
## 【符号の説明】

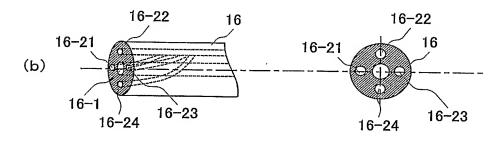
[0055]

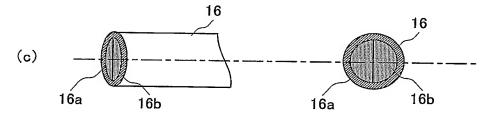
【書類名】図面

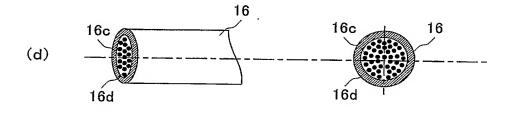


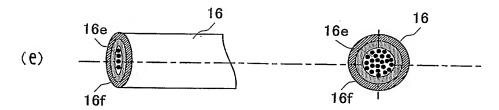
# 【図2】



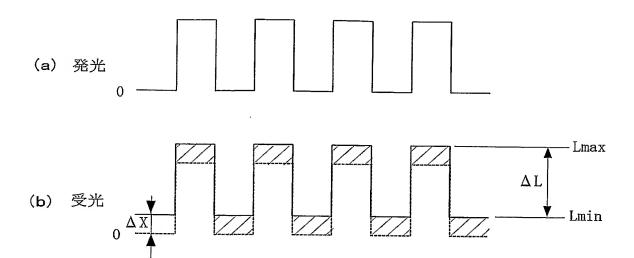




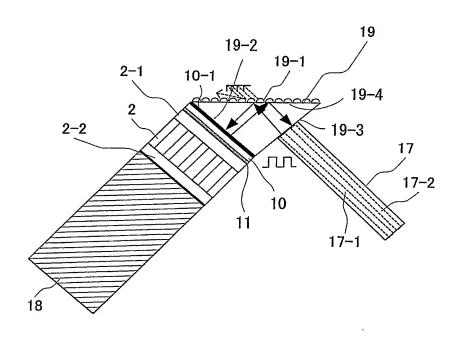




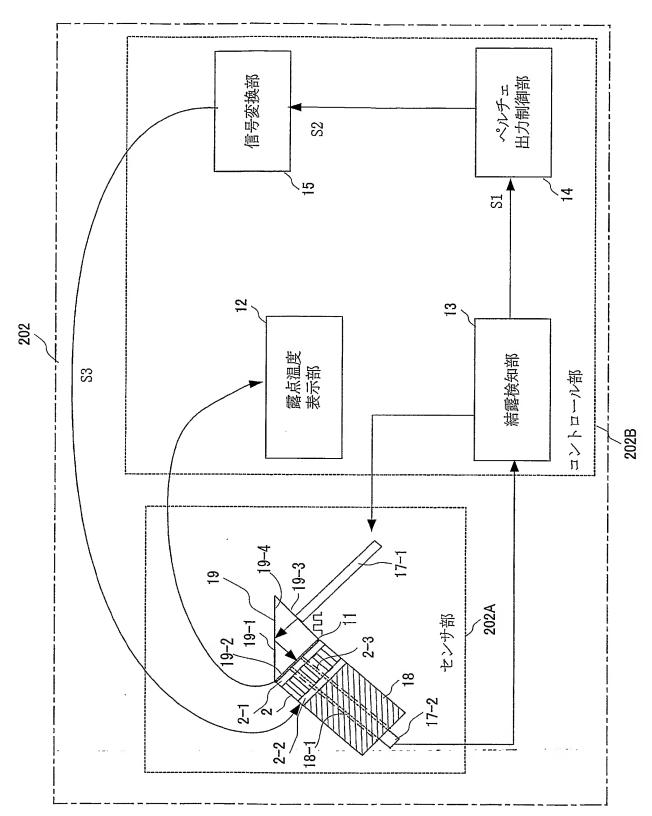
【図3】



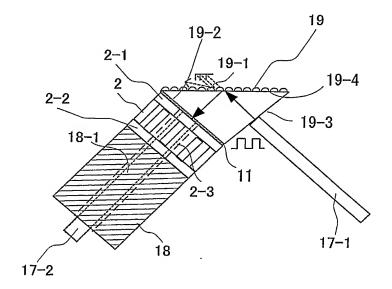
【図4】



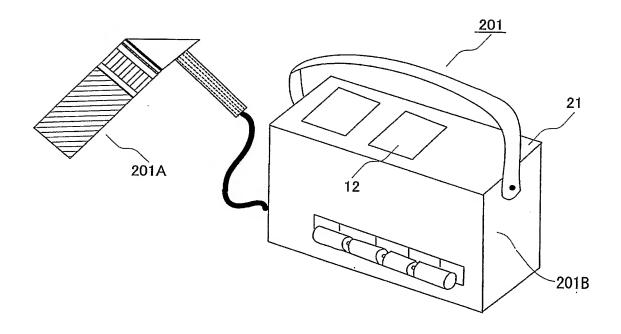




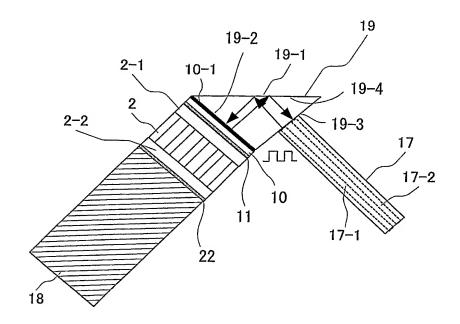
【図6】



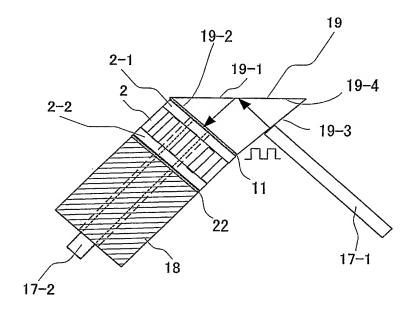
【図7】



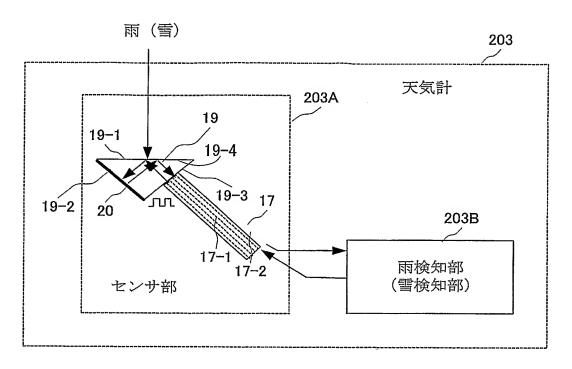
[図8]



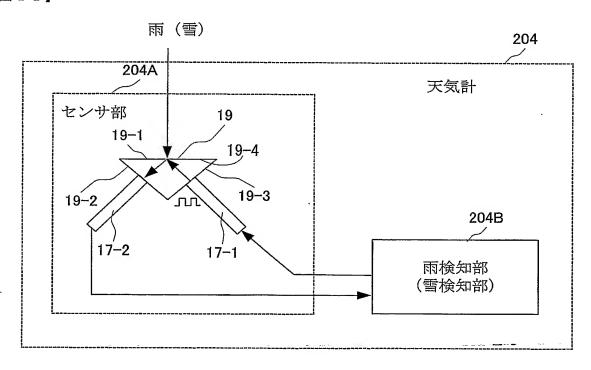
【図9】



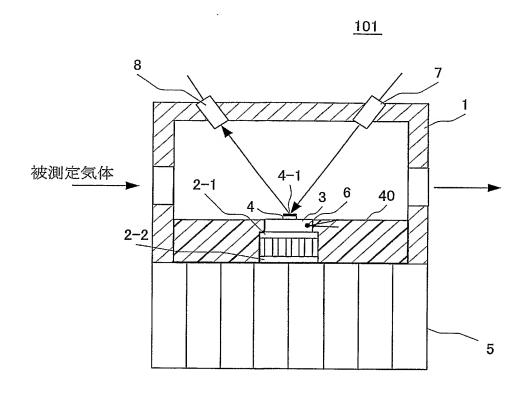
【図10】



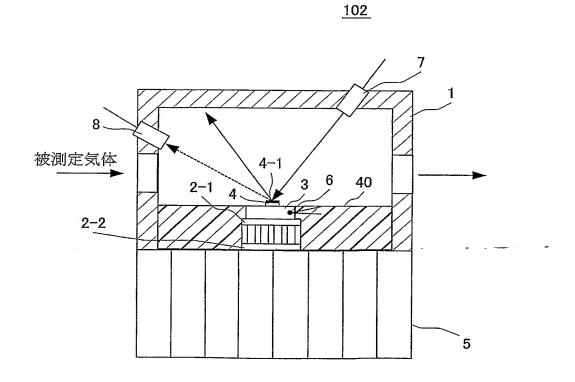
【図11】



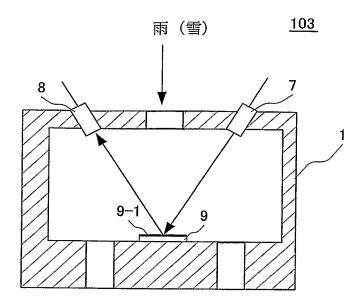
【図12】



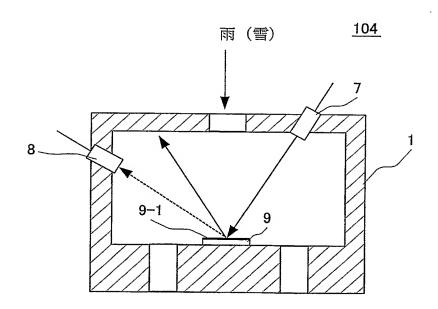
【図13】



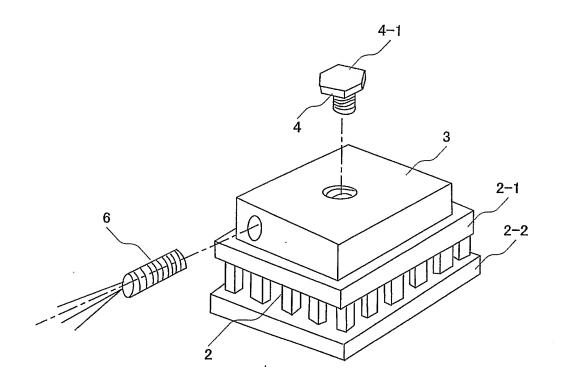
【図14】



【図15】



【図16】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】検出面の清掃をし易くする。ゴミの影響を受けづらくする。

【解決手段】三角プリズム19の長辺面19-1を検出面とする。プリズム19の短辺面19-3に投受光同軸の光ファイバケーブル17の先端部を接合する。プリズム19の短辺面19-2に熱電冷却素子2を取り付ける。熱電冷却素子2の冷却面2-1と短辺面19-2との間に鏡10を設ける。検出面19-1に結露が生じると、発光側の光ファイバ17-1から検出面19-1の裏面(検出面裏面)19-4に照射された光の一部がその結露を通してプリズム19の外へ抜ける。このため、検出面裏面19-4に照射された光の正反射光が減少する。この正反射光は鏡面10-1によって検出面裏面19-4に戻され、ここで再び正反射し、受光側の光ファイバ17-2に入る。この光ファイバ17-2を介して受光される光の強度変化によって検出面19-1に生じる結露を検出する。

【選択図】 図1

特願2004-101426

出願人履歴情報

識別番号

[000006666]

1. 変更年月日 [変更理由]

1998年 7月 1日

名称変更

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号

株式会社山武